	n Note	-

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent (Reexamination	under
10/791,825	INOUE, TAKAHIRO)
Examiner	Art Unit	
Long Nauven	2816	

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
327	427,429 432-434, 108, 376, 377	5/4/05	24	
326	82-84,89			
	rbue	12/12/05	in	
Bolon	e Nove	12/12/05	22	
·				
				

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
PG -	pub sea	MC 43	66 LN
(See	pain	t out)	
		٠	

SE (INCLUDING	ARCH NOT SEARCH	TES STRATEGY)
		DATE	EXMR
Fast		5/4/05	w
		·	
· .			
•	•		
			•
			•
•			
		·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	